УДК 538.956

# ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ L,α-АЛАНИНА НА СПОНТАННУЮ ЭВОЛЮЦИЮ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТА ВБЛИЗИ ТОЧКИ КЮРИ

© 2018 О. М. Голицына, С. Н. Дрождин, В. О. Лесникова

Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, 394018 Воронеж, Россия e-mail: golitsynaom@yandex.ru; drozhdin@phys.vsu.ru

Поступила в редакцию: 30.11.2018

Аннотация. Методом атомной силовой микроскопии в режиме пьезоотклика изучена эволюция неравновесной доменной структуры кристаллов чистого триглицинсульфата (ТГС) и с примесью L,  $\alpha$ -аланина (АТГС) вблизи температуры фазового перехода  $T_{\rm C}$  в температурном интервале  $\Delta T_{\rm C} = T_{\rm C} - T = 1$  К. В обоих кристаллах экспоненциально уменьшаются со временем общее число доменов N и полный периметр доменных границ L, диэлектрическая проницаемость  $\varepsilon$ , измеренная в слабом переменном электрическом поле. Изрезанность доменных границ в кристалле АТГС сохраняется с течением времени, приводя к росту значений среднего периметра домена L/N. Средняя скорость спонтанного бокового движения доменных границ в кристалле АТГС меньше чем в ТГС из-за демпфирующего действия дефектов. Вблизи  $T_{\rm C}$  оба кристалла являются открытыми системами с неконсервативным параметром порядка, и развитие доменной структуры происходит с изменением поверхностного заряда. При удалении от  $T_{\rm C}$  состояние с сохраняющимся параметром порядка достигается быстрее в дефектном кристалле АТГС.

**Ключевые слова:** атомная силовая микроскопия, триглицинсульфат, L,α-аланин, доменная структура, точка Кюри, кинетика, коэффициент униполярности, скорость доменных границ, периметр доменов.

DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/630

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Практическое использование сегнетоэлектрических кристаллов группы триглицинсульфата -ТГС (химическая формула (NH, CH, COOH), ·H, SO,) в качестве рабочих элементов пироэлектрических преобразователей сдерживается высокой чувствительностью их доменной структуры к различным внешним воздействиям [1]. Для минимизации этого фактора нестабильности пироэлектрических и иных свойств кристаллы ТГС в процессе роста легируются различными примесями внедрения и замещения (часто в их комбинации), среди которых наиболее эффективной признана примесь L,α-аланина [2]. Более крупная по сравнению с замещаемой молекулой глицина молекула L,α-аланина, имеющая нереверсируемую группу СН<sub>3</sub>, создает эффективные локальные поля – механических напряжений и электрическое [2], которые ориентируют дипольные моменты близлежащих молекул глицина. Тем самым в кристалле создается высокоуниполярное, близкое к монодоменному состояние с одним преимущественным направлением спонтанной поляризации. Эффективные механические напряжения ответственны за сдвиг температуры фазового перехода  $T_{\rm C}$  в область более высоких температур, а размытие фазового перехода обусловлено локальным электрическим полем [3].

Закономерности процессов перестройки доменной структуры кристаллов ТГС, как чистых, так и дефектных под действием внешних электрических полей изучены достаточно подробно [например, 4], но экспериментальная и теоретическая информация о спонтанной (т. е. не связанной с внешними полями) кинетике доменной структуры этих кристаллов, особенно на незначительном (до 1 К) удалении от точки фазового перехода кристаллов практически отсутствует, и соответствующие исследования являются актуальными.

В настоящей работе исследована эволюция доменной структуры кристаллов ТГС и ТГС+L, $\alpha$ -ала-

нин (АТГС) методом атомной силовой микроскопии пьезоотклика в температурном интервале шириной  $\Delta T_{\rm C} = T_{\rm C} - T = 1$  К вблизи температуры фазового перехода  $T_{\rm C}$ . Результаты таких исследований номинально чистого ТГС [5, 6] в настоящей работе частично приводятся только для сравнения с соответствующими зависимостями кристалла АТГС.

### ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКИ

Кристалл АТГС выращивался из пересыщенного раствора соли с содержанием 10 мол. % L,  $\alpha$  – аланина методом понижения температуры. Неравномерное вхождение примеси L,  $\alpha$ -аланина в объем выращиваемого кристалла приводит к неоднородному распределению поляризации, поэтому униполярность кристалла даже в пределах одной пирамиды роста может меняться [7].

Качество образцов для исследований оценивалось по значениям диэлектрической проницаемости в точке Кюри  $\varepsilon_{\text{max}}$ , измеренным в переменном электрическом поле с амплитудой 0.1 V на частоте 1000 Hz с помощью измерителя импеданса Wayne Kerr WK-4270. Использовались образцы со средними размерами  $5 \times 5 \times 1$  мм³ полярного скола по плоскости спайности [010] бруска из пирамиды роста (110). Непосредственно перед измерениями на них в вакууме были напылены серебряные электроды.

Для дальнейших исследований были отобраны образцы АТГС с относительно невысокой униполярностью (внутреннее поле смещения  $E_{\rm вн} \leq 500~{\rm V~cm^{-1}}$ ). Значения  $\epsilon_{\rm max}$  в режиме охлаждения, соответствующие температуре фазового перехода ( $T_{\rm C} = 322.5 \div 322.6~{\rm ^{\circ}C}$ ), для таких образцов составляли  $\sim 1.0 \div 1.5 \cdot 10^3$ .

Сильнолегированные образцы кристалла АТГС (значения  $\varepsilon_{\rm max}^{} < 10^3$ ) в настоящей работе не исследовались, поскольку сколь-либо заметные спонтанные изменения доменной структуры в них маловероятны. Протестированные образцы длительное время хранились при комнатной температуре в разомкнутом состоянии без каких-либо внешних воздействий. Доменные картины на плоскости (010) были получены с помощью атомно-силового микроскопа Solver P47 Pro с кантилевером NSG11/TiN в контактном режиме пьезоэлектрического отклика. Размеры сканируемой поверхности составляли 50×50µm. Температура поверхности сегнетоэлектрического образца измерялась терморезистором РТ100. Регулятор температуры, вмонтированный в головку микроскопа, позволил контролировать и поддерживать заданную температуру образца в диапазоне  $373 \div 273$  К с точностью не хуже, чем  $\pm 0.05$  К.

«Состаренные» образцы «омолаживались» выдержкой в течение 30 минут в параэлектрической фазе при температуре T = 333 К. Затем они охлаждались со скоростью  $\sim 10$  К min<sup>-1</sup> до T = 324 К и далее переводись в сегнетоэлектрическую фазу со скоростью, позволяющей минимизировать время установления заданной температуры.

Полученные доменные картины использовались для расчета числа доменов N, полного периметра доменных границ L, среднего размера домена < w>, средней скорости < v> движения доменных стенок, коэффициента статической униполярности  $\psi$ .

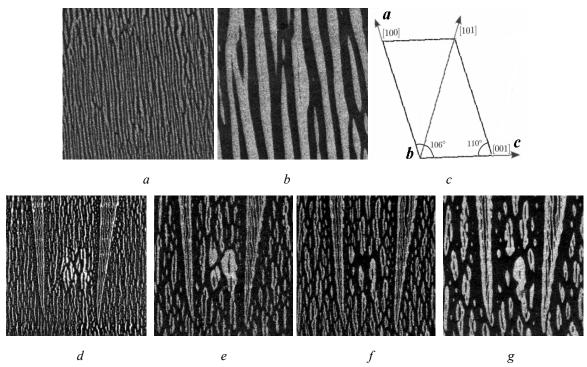
## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 представлены фрагменты двумерных АСМ изображений поверхности (010) кристалла номинально чистого ТГС при удалениях от точки Кюри равных:  $\Delta T_c = 0.3 \; \mathrm{K} - a, b$  и кристалла АТГС при  $\Delta T_c = 0.3 \; \mathrm{K} - d, e$  и  $\Delta T_c = 0.8 \; \mathrm{K} - f, g$ .

В кристалле АТГС (рис. 1d-g) наблюдается более мелкая по сравнению с ТГС (рис. 1a, b) ламелеподобная доменная структура с неровными ветвистыми доменными стенками. Измельчение доменной структуры, характерное для примесных кристаллов [8, 9], в АТГС связано с существованием дополнительных центров зарождения доменов на структурных неоднородностях при частичном замещении глицина L, $\alpha$ - аланином [10].

Развитие доменной структуры в АТГС качественно происходит также как в ТГС: она укрупняется, но менее интенсивно по сравнению с номинально чистым ТГС. Например, через  $\sim$ 50÷60 минут после перевода в полярную фазу геометрия доменов с характерными изрезанными границами меняется незначительно (рис. 1 e, g).

Визуальное сравнение доменных картин позволяет установить только качественное сходство их поведения в разных кристаллах группы ТГС: возникающие при фазовом переходе мелкие, вытянутые примерно вдоль направления [100] домены с размерами, отвечающими параметрам элементарной ячейки кристалла, со временем укрупняются, и этот процесс включает: і) исчезновение мелких доменов внутри крупных доменов противоположной полярности, іі) движение доменных стенок в направлениях [001] и [100], интенсивность которого определяется локальной кривизной границ, приводит, в том числе, к сглаживанию (выпрямле-



**Рис. 1.** Доменные картины на полярном сколе  $50\times50$  µm кристалла ТГС в моменты времени: a) 14 min; b) 50 min при  $\Delta T_{\rm C} = 0.3$  K [5]. Доменные картины на полярном сколе  $50\times50$  µm кристалла АТГС в моменты времени: d) 20 min; e) 52 min при  $\Delta T_{\rm C} = 0.3$  K. Доменные картины на полярном сколе  $50\times50$  µm кристалла АТГС в моменты времени: f) 12 min; g) 58 min при  $\Delta T_{\rm C} = 0.8$  K. Ориентация кристаллографических осей кристаллов ТГС и АТГС в плоскости (010) - c)

[Fig. 1. Domain patterns on a polar cleavages  $50 \times 50 \, \mu m$  of TGS crystal at time points: a) 14 min; b) 50 min at  $\Delta T_C = 0.3 \, K$ . [4]. Domain patterns on a polar cleavages  $50 \times 50 \, \mu m$  of ATGS crystal at time points: d) 20 min; e) 52 min at  $\Delta T_C = 0.3 \, K$ . Domain patterns on a polar cleavages  $50 \times 50 \, \mu m$  of ATGS crystal at time points: f) 12 min; g) 58 min at  $\Delta T_C = 0.8 \, K$ . Orientation of the crystallographic axes of TGS and ATGS crystals in the (010) plane -c)]

нию) доменных границ, iii) слияние (коалесценция) доменов одного знака с образованием более крупных и правильных по форме. Вместе с тем, интерес представляют количественные закономерности поведения доменной структуры и влияние на них структурных дефектов.

Количественными характеристиками доменной структуры, определяющими, в том числе, абсолютную величину диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  сегнетоэлектрика в полярной фазе, являются число доменов, наблюдаемых на поверхности кристалла N и суммарный периметр доменных границ L [11–13], временные зависимости которых представлены на рис. 2.

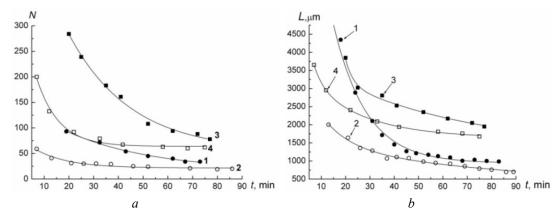
На сканируемых поверхностях одинаковой площади во всем исследованном временном интервале  $N_{\rm ATTC} > N_{\rm TTC}$  (рис. 2a). В непосредственной близости к  $T_{\rm C}$  зависимости N(t) наилучшим образом описываются одной экспонентой:  $N(t) = N_{\rm o} \exp(-t/\tau)$  со значениями  $\tau = 46.39 \pm 0.23$  мин —  $T\Gamma C$  (рис. 2a, кривая I) и  $\tau = 25.10 \pm 3.06$  мин —  $AT\Gamma C$  (рис. 2a, кривая 3). При небольшом понижении температуры

предпочтительнее функция:  $N(t) = N_{\rm ol} \exp(-t/\tau_1) + N_{\rm o2} \exp(-t/\tau_2)$ , где для ТГС (рис. 2a,  $\kappa$  ривая 2)  $\tau_1 = 5.19 \pm 0.98$  мин,  $\tau_2 = 352.53 \pm 7.22$  мин и для АТГС (рис. 2a,  $\kappa$  ривая 4)  $\tau_1 = 4.42 \pm 0.48$  мин,  $\tau_2 = 87.84 \pm 7.91$  мин. При обеих температурах значения времен релаксации для АТГС ниже, чем для чистого ТГС вследствие более быстрой локализации доменных границ в присутствии дефектов.

Экспоненциальное уменьшение величины L в кристалле АТГС (рис. 2b, кривые 3, 4) характеризуется значениями  $\tau_1 = 3.07 \pm 0.27$  мин и  $\tau_2 = 59.43 \pm 2.32$  мин при $\Delta T_{\rm C} = 0.3$  К;  $\tau_1 = 3.91 \pm 0.45$  мин и  $\tau_2 = 23.07 \pm 1.15$  мин при  $\Delta T_{\rm C} = 0.8$  К, а наиболее существенное уменьшение величины L происходит во временном интервале  $\sim 20-30$  минут с момента перевода кристалла в сегнетоэлектрическую фазу.

При одновременном уменьшении и L и N величина среднего периметра домена L/N в АТГС, тем не менее, растет с течением времени (рис. 3, *кривые 1*, 2), в отличие от номинально чистого ТГС [6].

Наиболее интенсивно укрупнение доменов в АТГС происходит вблизи  $T_{\rm C}$ , где во временном ин-

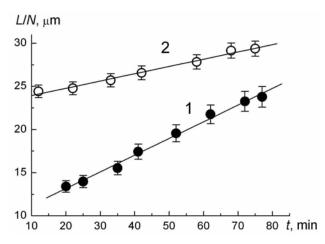


**Рис. 2.** Временные зависимости числа доменов N(t)-a) ТГС:  $1-\Delta T_{\rm C}=0.1$  К,  $2-\Delta T_{\rm C}=1.0$  К, АТГС:  $3-\Delta T_{\rm C}=0.3$  К,  $4-\Delta T_{\rm C}=0.8$  К (точки – эксперимент, линии – аппроксимация экспонентой). Временные зависимости полного периметра доменных границ L(t)-b) ТГС:  $1-\Delta T_{\rm C}=0.1$  К,  $2-\Delta T_{\rm C}=1.0$  К [6]; АТГС:  $3-\Delta T_{\rm C}=0.3$  К,  $4-\Delta T_{\rm C}=0.8$  К (точки – эксперимент, линии – аппроксимация экспонентой)

[Fig. 2. The time dependences of the number of domains N(t) –a) TGS: 1 -  $\Delta T_{\rm C}$  = 0.1 K, 2 -  $\Delta T_{\rm C}$  = 1.0 K; ATGS: 3 -  $\Delta T_{\rm C}$  = 0.3 K, 4 -  $\Delta T_{\rm C}$  = 0.8 K (the points are the experiment, the lines are the approximation by the exponent). The time dependences of the total perimeter of the domain boundaries L(t) –b) TGS: 1 -  $\Delta T_{\rm C}$  = 0.1 K, 2 -  $\Delta T_{\rm C}$  = 1.0 K [6]; ATGS: 3 -  $\Delta T_{\rm C}$  = 0.3 K, 4 -  $\Delta T_{\rm C}$  = 0.8 K (the points are the experiment, the lines are the approximation by the exponent)]

тервале наблюдения величина L/N увеличивается в 2 раза (рис. 3, *кривая 1*). Эти отличия в поведении L/N для АТГС при разных температурах связаны, вероятно, с сильной изрезанностью доменных границ в примесном кристалле, которая сохраняется и при удалении от  $T_{\rm C}$  в сторону низких температур (рис. 1d–g).

Поведение во времени доменной структуры кристалла АТГС в рассматриваемой температурной области можно, как и для чистого ТГС [14] сопоставить с релаксацией низкочастотной диэлектрической проницаемости, измеренной в слабом пе-



**Рис. 3.** Временные зависимости среднего периметра доменов кристалла АТГС:  $1-\Delta T_{\rm C}=0.3~{\rm K},\,2-\Delta T_{\rm C}=0.8~{\rm K}$ 

[Fig. 3. The time dependences of the average perimeter of domains of ATGS crystal:  $1 - \Delta T_{\rm C} = 0.3 \text{ K}, 2 - \Delta T_{\rm C} = 0.8 \text{ K}$ ]

ременном электрическом поле.

После перевода образца АТГС в полярную фазу значения диэлектрической проницаемости є с течением времени уменьшаются - заметно в окрестности температуры фазового перехода, но чем дальше от  $T_c$ , тем слабее, и в глубокой сегнетофазе временная зависимость є практически отсутствует. Такое изменение абсолютной величины є в АТГС также как и в ТГС, вызвано изменением доменной структуры, возникшей при фазовом переходе [5, 6, 14]. С течением времени доменные границы становятся менее подвижными из-за тормозящего действия дефектов, закрепляющих границы в местах их новой устойчивой локализации, а при понижении температуры, также и из-за роста коэрцитивного поля, затрудняющего процессы локальной переполяризации, связанные с осцилляциями доменных границ в измерительном электрическом поле.

Сравнение зависимостей  $\varepsilon(t)$  с L(t) и N(t) для ТГС и АТГС показано на рис. 4.

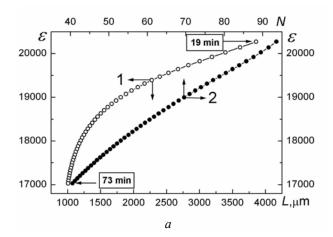
Видно, что уменьшение со временем L и N всегда сопровождается спадом значений  $\varepsilon_{_{\rm H3M}} \approx \varepsilon_{_{\rm дом}}$ . Связь  $\varepsilon-L$ , линейная для ТГС вблизи  $T_{_{\rm C}}$  в начальные моменты времени, становится затем нелинейной (рис. 4a,  $\kappa$  ривая I), поскольку дефекты, постепенно закрепляя часть доменных стенок, «выключают» их из процессов локальной переполяризации. При этом связь  $\varepsilon-N$  практически линейна во всем исследованном временном интервале (рис. 4a,  $\kappa$  ривая 2). При небольшом понижении температу-

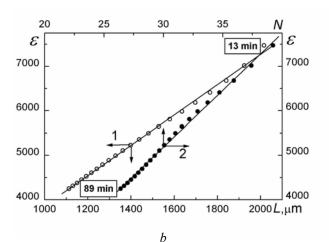
ры обе зависимости —  $\varepsilon(L)$  и  $\varepsilon(N)$  становятся линейными для ТГС во всем исследованном временном интервале (рис. 4b,  $\kappa$ ривые l, 2). Для АТГС эти зависимости линейны и вблизи  $T_{\rm C}$  (рис. 4c,  $\kappa$ ривые l, 2). В двух последних случаях дополнительное существенное закрепление доменных стенок дефектами не происходит, и поэтому понижение значений  $\varepsilon$  связано преимущественно только с уменьшением L и N.

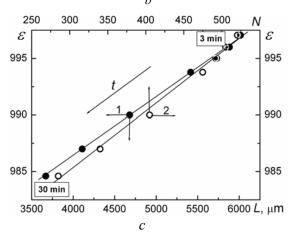
Кинетика процесса спонтанной эволюции доменной структуры наглядно прослеживается по поведению средней скорости смещения доменных границ, которая и в чистом, и в примесном кристалле постоянна вблизи  $T_{\rm C}$  (рис. 5, *кривые 1, 3*), а при понижении температуры демонстрирует быстрый двухэкспоненциальный спад с временами релаксации  $\tau_1 = 2$  min,  $\tau_2 = 25$  min для ТГС и  $\tau_1 = 2$  min,  $\tau_2 = 35$  min для АТГС (рис. 5, *кривые 2, 4*). При этом абсолютные значения <v> в АТГС всегда примерно на порядок ниже, чем в ТГС, что естественно объяснить присутствием примесных дефектов, тормозящих движение стенок в АТГС.

При исследованиях различных систем, быстро охлажденных через критическую точку из неупорядоченной однородной фазы в упорядоченную двухфазную, динамика упорядочения оценивается по поведению характерного масштаба *l* областей новой фазы – доменов [15]. Считая сегнетоэлектрическую доменную структуру такой упорядоченной двухфазной системой, возникшей в результате фазового перехода, осуществленного с конечной скоростью, можно рассматривать средний линейный размер домена < w >, как аналог l [15], исследовать его временные зависимости < w > (t) и сравнивать их с зависимостями l(t). В ряде работ [16-18] было показано, что развитие доменов (областей с разным знаком скалярного параметра порядка  $\pm \eta_{o}$ , претерпевающих макроскопическое упорядочение), описывается зависимостью  $l(t) \sim t^{1/2}$  в системах с несохраняющимся параметром порядка и  $l(t) \sim t^{1/3}$  в системах с сохраняющимся параметром порядка.

В непосредственной близости к температуре фазового перехода в обоих кристаллах (рис. 6a, b кривые I) временная зависимость  $< w>_{[001]}$  практически линейна:  $< w>_{[001]}(t) \sim t^{\varphi}$ , где  $\varphi \approx 1$ , что не согласуется с существующими теоретическими

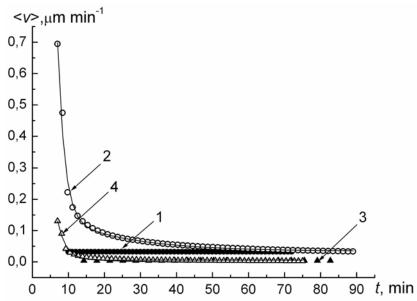




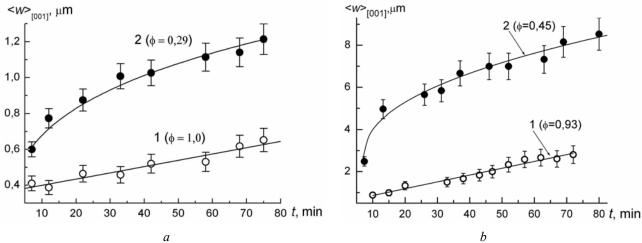


**Рис. 4.** Зависимости низкочастотной диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  от полного периметра доменных границ L (*кривые 1*) и от полного числа доменов N (*кривые 2*) для разных моментов времени: a) ТГС при  $\Delta T_C = 0.3$  °C, b) ТГС при  $\Delta T_C = 1.0$  °C, c) АТГС при  $\Delta T_C = 0.3$  °C

[**Fig. 4**. The dependences of the low-frequency dielectric constant  $\varepsilon$  on the total perimeter of domain boundaries L (*curves 1*) and on the total number of domains N (*curves 2*) for different times: a) TGS at  $\Delta T_{\rm C} = 0.3$  °C, b) TGS at  $\Delta T_{\rm C} = 1.0$  °C, c) ATGS at  $\Delta T_{\rm C} = 0.3$  °C]



**Рис. 5.** Временные зависимости средней скорости развития доменов в направлении [001]: ТГС – кривые 1, 2; АТГС – кривые 3, 4.  $\Delta T_{C}$  = 0.1 K – 1;  $\Delta T_{C}$  = 0.3 K – 3;  $\Delta T_{C}$  = 1.0 K – 2;  $\Delta T_{C}$  = 0.8 K – 4 [**Fig. 5**. The time dependences of the average rate of development of domains in the direction [001]: TGS - curves 1, 2; ATGS - curves 3, 4.  $\Delta T_{C}$  = 0.1 K – 1;  $\Delta T_{C}$  = 0.3 K – 3;  $\Delta T_{C}$  = 1.0 K – 2;  $\Delta T_{C}$  = 0.8 K – 4]



**Рис. 6.** Зависимости  $< w>_{[001]}$ (t): a) для кристалла АТГС:  $1 - \Delta T_{\rm C} = 0.3~{\rm K}$ ,  $2 - \Delta T_{\rm C} = 0.8~{\rm K}$ ; b) для кристалла ТГС:  $1 - \Delta T_{\rm C} = 0.1~{\rm K}$ ,  $2 - \Delta T_{\rm$ 

представлениями [15], но наблюдалось экспериментально [19] для чистого кристалла ТГС методом нематических жидких кристаллов в интервале  $\Delta T_{\rm C} \approx 0.4$  K, а, следовательно, этот результат требует дальнейшего изучения. Незначительное удаление от  $T_{\rm C}$  понижает значения  $\phi$  до 0.29 в АТГС (рис. 6а, кривая 2), указывая на консервативность параметра порядка в этом кристалле, и до 0.45 в ТГС (рис. 6b, кривая 2), свидетельствуя, вероятно, о неконсервативности параметра порядка. Результат, полученный здесь для АТГС, хорошо коррели-

рует с теоретическими данными, представленными в литературе, но для ТГС только в одной работе [20] при T = 47 °C было получено значение  $\phi$  = 0.5. Если вблизи температуры фазового перехода любой кристалл с его доменной структурой является сильно неравновесной системой, чувствительной к незначительным изменениям внешних условий, то при удалении от  $T_{\rm C}$  он постепенно переходит к состоянию с сохраняющимся параметром порядка, которое благодаря присутствию дефектов, затормаживающих динамику доменов, достигается

раньше при понижении температуры в кристалле АТГС, и для ТГС такое состояние по нашим оценкам [12, 14] может быть достигнуто при удалении от точки Кюри  $\Delta T_{\rm C} \approx 2 \div 3~{\rm K}.$ 

Согласно [21], в качестве параметра дальнего порядка в сегнетоэлектрике с фазовым переходом типа порядок-беспорядок рассматривается величина

$$S = (n - n)/n$$

где n — число диполей в единице объема кристалла, из которых  $n_+$  и  $n_-$  ориентированы при данной температуре, соответственно, в положительном и отрицательном направлениях вдоль полярной оси. Величины

$$x_{+} \equiv n_{+} / n, \ x_{-} \equiv n_{-} / n$$

это вероятности того, что диполь ориентирован, соответственно, в положительном и в отрицательном направлении. Очевидно, что

$$x_{\perp} + x_{\perp} = 1 \text{ M } x_{\perp} - x_{\perp} = S.$$

Введенный таким образом параметр порядка *S*, по смыслу практически ничем не отличается от коэффициента статической униполярности, определяющего степень макроскопического упорядочения полидоменного сегнетоэлектрика через разность площадей «положительных» и «отрицательных» доменов, отнесенную к общей площади полярного среза образца:

$$\psi(t,T) = (\sigma_{\perp} - \sigma) / \sigma.$$

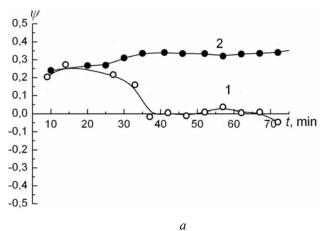
Значение  $0 \le |\psi| \le 1$  определяет абсолютную величину макроскопической поляризация полидо-

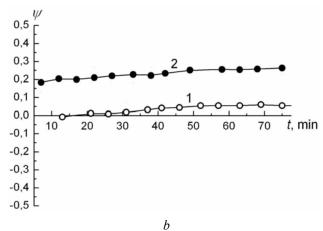
менного сегнетоэлектрика  $P_{s}(T,t) = \psi(t,T) \cdot P_{s}(T)$ .

Возникающие при фазовом переходе распределения поляризации в объеме кристалла и поляризационного заряда на его поверхности меняются во времени за счет объемных и поверхностных носителей заряда [22], что может приводить при постоянной температуре к изменению  $\psi$ . Поэтому поведение  $\psi(t,T=\text{const})$ , как параметра дальнего порядка, позволяет оценить степень консервативности системы. В работе [23] для линзообразных доменов при комнатной температуре и в работе [13] для ламелеобразных доменов при T=316 К было установлено, что полный заряд поверхности образца сохраняется.

Зависимости  $\psi(t)$  для кристаллов АТГС и ТГС приведены на рис. 7.

Наиболее заметные изменения значений у при стремлении доменной системы к равновесному состоянию происходят вблизи  $T_{\rm C}$  примерно в течение первых  $\sim 30$  минут (рис. 7a), что можно рассматривать как свидетельство неконсервативности параметра порядка в этом временном интервале, причем в кристалле ТГС эти изменения выражены значительно сильнее (рис. 7а, кривая 1), чем в АТГС. По прошествии этого времени  $\psi$  практически перестает меняться, слабо осциллируя вблизи  $\psi = 0$ в ТГС и  $\psi$  = 0.35 в АТГС. При чуть более низких температурах (рис. 7b) значения  $\psi$  не претерпевают существенных изменений со временем, что указывает на формирование доменной структуры обоих кристаллов уже в условиях сохранения поверхностного заряда.





**Рис. 7.** Временные зависимости коэффициента статической униполярности: a) для ТГС при  $\Delta T_{\rm C} = 0.1~{\rm K} - 1~{\rm M}$  АТГС при  $\Delta T_{\rm C} = 0.3~{\rm K} - 2$ ; b) для ТГС при  $\Delta T_{\rm C} = 1.0~{\rm K} - 1~{\rm M}$  АТГС при  $\Delta T_{\rm C} = 0.8~{\rm K} - 2$ 

[Fig. 7. The time dependences of the coefficient of static unipolarity: a) for TGS with  $\Delta T_{\rm C} = 0.1~{\rm K} - 1$  and ATGS with  $\Delta T_{\rm C} = 0.3~{\rm K} - 2$ ; b) for TGS at  $\Delta T_{\rm C} = 1.0~{\rm K} - 1$  and ATGS at  $\Delta T_{\rm C} = 0.8~{\rm K} - 2$ ]

### выводы

- 1. Для кристаллов ТГС и ТГС+L, $\alpha$ -аланин (АТГС) исследована эволюция свежеобразованной доменной структуры методом атомной силовой микроскопии пьезоотклика вблизи температуры фазового перехода  $T_C$  в температурном интервале шириной  $\Delta T_C = T_C T = 1$  К. При качественном подобии развития доменной структуры в кристаллах ее трансформация в АТГС происходит менее интенсивно, чем в номинально чистом ТГС.
- 2. В ТГС и АТГС укрупнение доменной структуры сопровождается экспоненциальным уменьшением во времени числа доменов N и полного периметра доменных границ L. Во всем исследованном временном интервале  $N_{\rm ATTC} > N_{\rm TTC}$ .
- 3. В отличие от номинально чистого ТГС в АТГС величина среднего периметра домена L/N растет с течением времени вследствие сильной изрезанности доменных границ и вблизи  $T_{\rm C}$ , так и при более низких температурах.
- 4. В ТГС и АТГС средняя скорость движения доменных границ остается постоянной во времени вблизи точки Кюри и экспоненциально уменьшается со временем при удалении от нее.
- 5. В температурном интервале  $\Delta T_C = T_C T = 1~\mathrm{K}$  временные зависимости среднего линейного размера домена < w > описываются функцией  $< w > \sim t^{\varphi}$ , где  $0.45 \le \varphi \le 0.93$  для номинально чистого ТГС и  $0.29 \le \varphi \le 1$  для АТГС. Значения  $\varphi \approx 1$  в непосредственной близости к  $T_C$ . При понижении температуры состояние с консервативным параметром порядка, характеризуемое значением  $\varphi = 0.3$ , достигается быстрее в кристалле АТГС благодаря наличию дефектов.
- 6. Коэффициент статической униполярности  $\psi$ , характеризующий степень макроскопического упорядочения кристалла и величину поверхностного заряда, наиболее сильно изменяется вблизи  $T_{\rm C}$  в первые 30 минут, указывая на открытость системы. При понижении температуры  $\psi$  не претерпевает значительных изменений с течением времени и доменная структура кристаллов ТГС и АТГС формируется в условиях сохранения поверхностного заряда.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные материалы. М.: Мир, 1981, 736 с.

- 2. Цедрик М. С. Физические свойства кристаллов семейства триглицинсульфата. Минск, Наука и техника, 1986, 216 с.
- 3. Галстян Г. Т., Рез И. С., Рейзер М. Ю. //  $\Phi TT$ , 1982, т. 24, с. 2186–2190.
- 4. Дрождин С. Н., Голицына О. М., Никишина А. И. и др. //  $\Phi$ TT, 2006, т. 48, № 3, с. 497–500.
- 5. Golitsyna O. M., Drozhdin S. N., Chulakova V. O., Grechkina M. N. // *Ferroelectrics*, 2017, vol. 506, p. 127. DOI: https://doi.org/10.1080/00150193/2017.1282286
- 6. Голицына О. М., Дрождин С. Н., Коробова А. Д., Чулакова В. О. // Конденсированные среды и межфазные границы, 2017, т. 19, № 1, с. 42. DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2017.19/175
- 7. Тихомирова Н. А., Гинзберг А. В., Донцова Л. И., и др. // *ФТТ*, 1986, т. 28, № 3, с. 3055–3058.
- 8. Константинова В. П., Станковска Я. // *Кристал-лография*, 1971, т. 16, с. 158–163.
- 9. Моравец Ф., Константинова В. П. // *Кристаллография*, 1968, т. 13, с. 284–289.
- 10. Донцова Л. И., Тихомирова Н. А. // *Письма в*  $\mathcal{K}$ Э $T\Phi$ , 1985, т. 41, с. 183–185.
- 11. Новик В. К., Лотонов А. М., Гаврилова Н. Д. // *ФТТ*, 2009, т. 51, № 7, с. 1338–1343.
- 12. Дрождин С. Н., Голицына О. М. // *ФТТ*, 2012, т. 54, № 5, с. 853–858.
- 13. Likodimos V., Labardi V., Allegrini M. // *Phys. Review B*, 2000, vol. 61, № 21, pp. 14440–1447. DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.61.14440
- 14. 14.Голицына О. М., Гречкина М. В., Дрождин С. Н., Чулакова В. О. // Конденсированные среды и межфазные границы, 2016, т. 18, № 4, с. 494–504.
- 15. Bray A. J. // *Advances in Physics*, 1994, vol. 43, pp. 357–459. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00018739400 101505
- 16. Oono Y., Puri S. // *Phys. Review Letters*, 1987, vol. 58, № 8, pp. 836–839. DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.58.836
- 17. Schins A. G., Arts A. F. M., de Wijn H. W. // *Phys. Review Letters*, 1993, vol. 70, pp. 2340–2343. DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.70.2340
- 18. Abplanalp M., Eng L. M., Günter P. // *Appl. Phys. A*, 1998, vol. 66, pp. S231–S234. DOI: https://doi.org/10.1007/s003390051136
- 19. Nakatani N. // *Japan. J. of Appl. Phys.*, 1985, vol. 24, № 7, pp. L528–L530. DOI: https://doi.org/10.1143/jjap.24. 1528
- 20. Likodimos V., Orlik X. K., Pardi L., et al. // *J. of Applied Physics*, 2000, vol. 87, pp. 443–451. DOI: https://doi.org/10.1063/1.371882

# EFFECT OF L,α-ALANINE IMPURITY ON THE SPONTANEOUS EVOLUTION OF THE DOMAIN STRUCTURE OF TRIGLICINE SULPHATE NEAR THE CURIE POINT

## © 2018 O. M. Golitsyna, S. N. Drozhdin, V. O. Lesnikova

Voronezh State University, 1, Universitetskaya pl., 394018 Voronezh, Russia e-mail: golitsynaom@yandex.ru; drozhdin@phys.vsu.ru

Received 30.11.2018

**Abstract.** Using the atomic force microscopy method in the piezoelectric response mode, the evolution of the nonequilibrium domain structure of pure triglycine sulfate (TGS) crystals and doped with an L,  $\alpha$ -alanine (ATGS) impurity was studied near the phase transition temperature over the interval  $\Delta T_{\rm C} = T_{\rm C} - T = 1$  K. In both crystals the total number of domains N, the total perimeter of domain boundaries L and also the dielectric constant  $\epsilon$ , measured in a weak ac electric field, decrease exponentially upon time. The ruggedness of the domain boundaries in the ATGS crystal persists over time, leading to an increase of the average domain perimeter L/N. The average velocity of spontaneous lateral movement of domain boundaries in a TGS crystal is less than in ATGS, due to the damping influence of defects. Near  $T_{\rm C}$ , both crystals are open systems with a non-conservative order parameter, and the development of the domain structure occurs with a change of the surface charge. With distance from the  $T_{\rm C}$ , the state with a conserved order parameter is reached faster in ATGS crystal.

**Keywords**: atomic force microscopy, triglycine sulfate,  $L,\alpha$ -alanine, domain structure, Curie point, kinetics, coefficient of unipolarity, velocity of domain boundaries, domain perimeter.

DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/630

#### REFERENCES

- 1. Lines M. E. and Glass A. M. *Principle and Applications of Ferroelectrics and Related Materials*. New York, Clarendon, 1982, 680 p.
- 2. Cedrik M. S. *Fizicheskie svojstva kristallov seme-jstva triglicinsul'fata* [The Physical Properties of the Triglycine Sulfate Family of Crystals.]. Minsk, Nauka i Tekhnika Publ., 1986, 216 p. (in Russ.)
- 3. Galstyan G. T., Rez I. S., Rejzer M. Yu. *Fizika Tverdogo Tela* [Physics of the Solid State], 1982, vol. 24, pp. 2186–2190. (in Russ.)
- 4. Drozhdin S. N., Golitsyna O. M., Nikishina A. I., et al. *Fizika Tverdogo Tela* [Physics of the Solid State], 2006, vol. 48, iss. 3, pp. 532–536. DOI: https://doi.org/10.1134/S106378340603019X
- 5. Golitsyna O. M., Drozhdin S. N., Chulakova V. O., Grechkina M. N. *Ferroelectrics*, 2017, vol. 506, p. 127. DOI: https://doi.org/10.1080/00150193/2017.1282286
- 6. Golitsyna O. M., Drozhdin S. N., Korobova A. D., Chulakova V. O. *Condensed Matter and Interphases*, 2017, vol. 19, no. 1, p. 42. DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2017.19/175 (in Russ.)
- 7. Tihomirova N. A., Ginzberg A. V., Doncova L. I., et al. *Fizika Tverdogo Tela* [Physics of the Solid State], 1986, vol. 28, iss. 3, pp. 3055–3058. (in Russ.)
- 8. Konstantinova V. P., Stankovska Y A. *Kristallografi-ya* [Crystallography Reports], 1971, vol. 16, pp. 158–163. (in Russ.)

- 9. Moravec F., Konstantinova V. P. *Kristallografiya* [Crystallography Reports], 1968, vol. 13, pp. 284–289. (in Russ.)
- 10. Doncova L. I., Tihomirova N. A. *Pis'ma v ZHEHTF* [Technical Physics Letters], 1985, vol. 41, pp. 183–185. (in Russ.)
- 11. Novik V. K., Lotonov A. M., Gavrilova N. D. *Fizika Tverdogo Tela* [Physics of the Solid State], 2009, vol. 51, iss. 7, pp. 1414–1419. DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783409070221
- 12. Drozhdin S. N., Golitsyna O. M. *Fizika Tverdogo Tela* [Physics of the Solid State], 2012, vol. 54, iss. 5, pp. 905–910. DOI: https://doi.org/10.1134/S10637834 12050071
- 13. Likodimos V., Labardi V., Allegrini M. *Phys. Review B*, 2000, vol. 61, no. 21, pp. 14440–1447. DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.61.14440
- 14. Golitsyna O. M., Grechkina M. V., Drozhdin S. N., Chulakova V. O. *Condensed Matter and Interphases*, 2016, vol. 18, no. 4, pp. 494–504. Available at: http://www.kcmf.vsu.ru/article.php?l=ru&aid=776 (in Russ.)
- 15. Bray A. J. *Advances in Physics*, 1994, vol. 43, pp. 357–459. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00018739400 101505
- 16. Oono Y., Puri S. *Phys. Review Letters*, 1987, vol. 58, no. 8, pp. 836–839. DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.58.836

## ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ L,А-АЛАНИНА НА СПОНТАННУЮ ЭВОЛЮЦИЮ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ...

- 17. Schins A. G., Arts A. F. M., de Wijn H. W. *Phys. Review Letters*, 1993, vol. 70, pp. 2340–2343. DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.70.2340
- 18. Abplanalp M., Eng L. M., Gьnter P. *Appl. Phys. A*, 1998, vol. 66, pp. S231–S234. DOI: https://doi.org/10.1007/s003390051136
- 19. Nakatani N. Japan. *J. of Appl. Phys.*, 1985, vol. 24, no. 7, pp. L528–L530. DOI: https://doi.org/10.1143/jjap.24. 1528
- 20. Likodimos V., Orlik X. K., Pardi L., et al. *J. of Applied Physics*, 2000, vol. 87, pp. 443–451. DOI: https://doi.org/10.1063/1.371882

Голицына Ольга Михайловна – к. ф.-мат. н., доцент, Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия; тел.: +7 (473) 2208625, e-mail: golitsynaom@yandex.ru

Дрождин Сергей Николаевич — д. ф.-м. н., профессор, заведующий кафедрой, Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия; тел.: +7 (919) 1824460, e-mail: drozhdin@phys.vsu. ru

Лесникова Валерия Олеговна — аспирант, Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия; тел.: +7 (473) 2208625, e-mail: chulakovavo@mail.ru

Olga M. Golitsyna – Cand. Sci. (Phys.-Math.), Assistant Professor, Voronezh State University, Voronezh, Russia; tel.: +7 (473) 2208625, e-mail: golitsynaom@yandex.ru

Sergey N. Drozhdin – Dr. Sci. (Phys.-Math.), Full Professor, Head of Department, Voronezh State University, Voronezh, Russia; tel.: +7 (919) 1824460, e-mail: drozhdin@phys.vsu.ru

Valeriya O. Lesnikova – Graduate Student, Voronezh State University, Voronezh, Russia; tel.: +7 (473) 2208625, e-mail: chulakovavo@mail.ru